

# 講演会のお知らせ

## 講師紹介

### Juin J. Liou

Pegasus  
Distinguished  
Professor and  
Lockheed Martin  
St. Laurent  
Professor of  
Engineering,  
University of  
Central Florida,  
Orlando, Florida,  
USA

Chang Jiang  
Scholar Endowed  
Professor, Ministry  
of Education,  
China

Fellow of IEEE,  
Fellow of IET,  
Fellow of AAAS

#### <お問合せ>

群馬大学大学院理工学府  
電子情報部門  
尹 友  
Tel :0277-30-1724

USA の University of Central Florida の教授 Juin J. Liou 先生をお招きし、Electrostatic Discharge (ESD) Protection の講演会を開催いたします。

多くの方々のご参加をお待ちしております。

日時:平成 27 年 3 月 10 日(火)  
10 時 30 分~11 時 30 分

場所:群馬大学理工学図書館 2 階多目的ホール

**※本講演は申込不要です。直接会場にお越しください**

題目: **Outlook and Challenges of Electrostatic Discharge (ESD) Protection of Modern and Future Integrated Circuits**

講師: Juin J. Liou 氏

講演概要: Electrostatic discharge (ESD) is one of the most prevalent threats to the reliability of electronic components.

An overview on the ESD sources, models, protection schemes, and testing will first be given in this talk. This is followed by presenting the challenges of designing and realizing ESD protection solutions for integrated circuits in Si CMOS, Si BiCMOS, GaAs, GaN, and emerging technologies. Challenges and difficulties associated with the ESD design and optimization for these technologies will be addressed.